

2025年度 第17回 LSI テストセミナー

日時：2026年3月3日（火）9時～21時

場所：電気ビル本館 7号カンファレンス

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 1-1-1 電気ビル本館 地下 2F

TEL: 092-781-0681

9時30分～9時35分 会場設営・受付

9時35分～9時40分 オープニング 大竹 哲史（大分大）

9時40分～10時10分

耐ソフトウェア記憶素子の機能検証に関する研究

○山村 龍之介（九工大），瀧上 天翔（九工大），ホルスト シュテファン（九工大），温 暁青（九工大），宮瀬 紘平（九工大），陳 伯奇（国立台湾科技大学）

10時10分～10時40分

故障検出条件を用いた複数テストキューブの生成手法について

○松永裕介（九州大）

10時40分～11時10分

一様なランダムパターンに対する故障検出確率の算出手法

○小泉優哉，細川利典（日本大），吉村正義（京都産業大）

11時10分～11時20分

休憩

11時20分～11時50分

RISC-V プロセッサのプログラムレベル擬似乱数テスト

濱村心之丞，○大竹哲史（大分大）

11時50分～12時20分

データパスの時間展開モデルを用いた推定フィールドランダムテストビリティ向上のための制御信号系列のドントケア割当て手法

○仲本千騎・細川利典（日大）・吉村正義（京都産大）

12時20分～13時40分

休憩・所連絡

13時40分～14時10分

EVA100 の概要およびスタートアップテキストマニュアルの紹介

○爲廣 拓人（アドバンテスト九州システムズ）

14 時 10 分～14 時 40 分

Securing Reconfigurable Scan Networks

○Erik Larsson (Lund University, Sweden)

14 時 40 分～15 時 10 分

ドントケア数増大のためのドントケア判定アルゴリズム

○澤田太生, 細川利典 (日大), 吉村正義 (京都産大)・新井雅之 (日大)

15 時 10 分～15 時 20 分

休憩

15 時 20 分～15 時 50 分

加速度センサを用いたバットスイング動作分類における

オーディオデータ拡張による学習データ増加に関する研究

○焼山優一, 本田俊光, 宮瀬紘平, Stefan Holst (九工大), 石川秀大 (大分高専), Roshwin Sengupta, Ilia Polian (Stuttgart 大)

15 時 50 分～16 時 20 分

マルチプレクサのドントケア入力を用いた識別可能故障ペア推定数改善のための制御ポイント挿入手法

○YUN YEONGKYEONG, 細川利典 (日本大), 吉村正義 (京都産業大), 山崎浩二 (明治大)

16 時 20 分～16 時 30 分

休憩

16 時 30 分～17 時

ユニタリ故障向け量子テストパターンの非ユニタリ故障検出能力の評価

○福元愛叶, 賀川経夫, 大竹哲史 (大分大)

17 時～17 時 30 分

BIST におけるテストパターンの統計的ランダム性と故障検出率の相関分析

吉川慶, ○吉村正義 (京都産業大)

休憩 (17 時 30 分～18 時)

18 時～21 時

LSI テストに関する討論